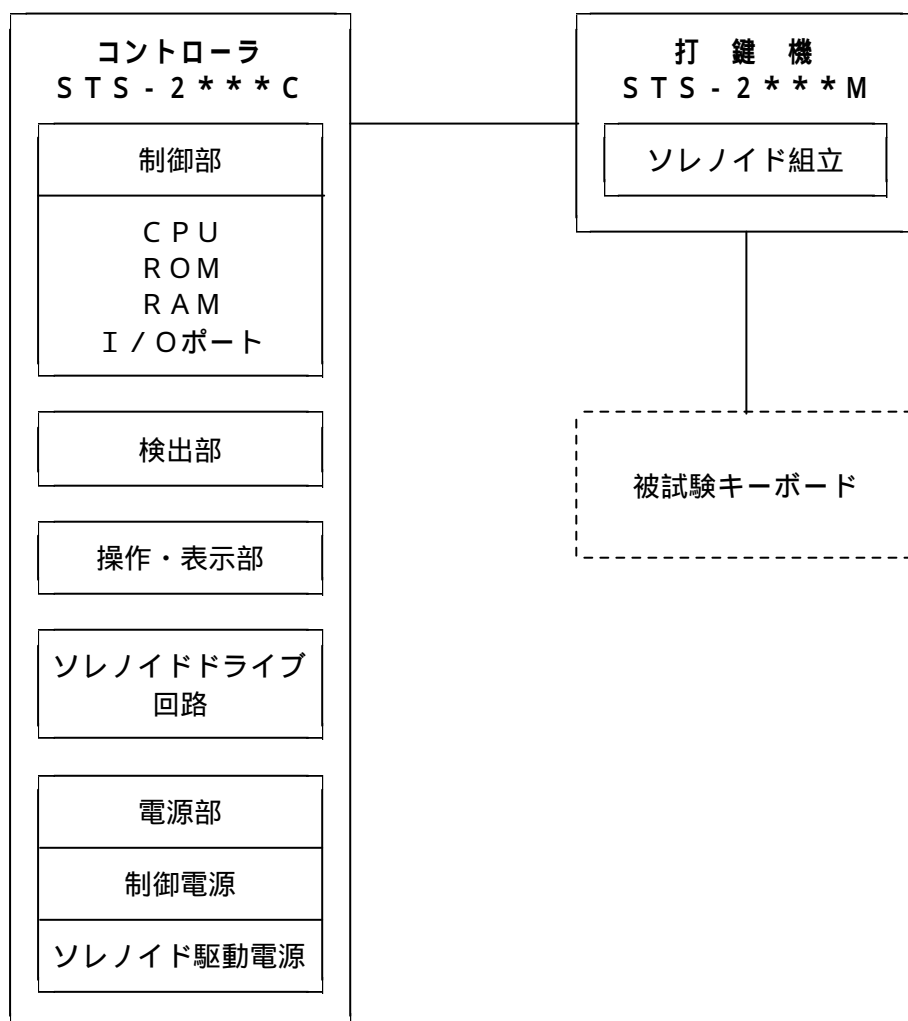


# 出荷 / 耐久試験装置

## 1 . 概要

本装置はキーボードの打鍵耐久性試験及び打鍵検査装置です。  
被試験キーボードを、打鍵機のソレノイドによって順次打鍵又は、同時打鍵（最大6キー）します。  
指定間隔回数毎に打鍵を一時停止しながら、トータル指定回数まで打鍵耐久性試験を行う事が出来ます。  
マトリクスパターンのある被試験キーボードに対しては、ティーチング方式により、個々の被試験キーボードのマトリクスデータをRAMに書き込み、その内容に従って打鍵機のソレノイドを順次駆動し、被試験キーボードを打鍵しながら出力されたキー信号の検査・測定を行い、その良否判定を行う機能があります。  
この検査。測定は、打鍵耐久性試験中の指定間隔回数毎に行う事も出来ます。

## 2 . 構成



### 3 . 仕様

#### 3 . 1 コントローラ S T S - 2 \* \* \* C

	項目	仕様
3.1(1)	使用 電源電圧	A C 1 0 0 V ± 1 0 [ V ] 5 0 / 6 0 [ H z ]
(2)	使用 温度範囲	0 ~ 4 0 [ ]
(3)	使用 湿度範囲	2 0 ~ 8 0 [%] (但し結露しないこと)
(4)	外形寸法	4 8 0 ( W ) × 2 0 0 ( H ) × 3 5 0 ( D ) [ m m ]
(5)	ソレノイド 駆動電源	3 0 [ V ] · 2 [ A ]
(6)	ソレノイド 通電電流	0 ~ 0 . 8 [ A ] (押し圧力調整用)
(7)	打鍵キー数	標準 2 4 キー
(8)	打鍵 パターン	内蔵ROMにより、固定
(9)	打鍵頻度	耐久打鍵時 — { 1 キー当たり 1 ~ 5 回 / 秒 ( 5 段階可変 ) 検査時 — { 1 キー当たり 3 回 / 秒
(10)	打鍵動作 カウンタ	プリセット付き 1 サイクル打鍵で 1 カウント ( 8 桁 )
(11)	検査・測定 機能	検査時、もしくは打鍵耐久試験時の指定間隔回数 の検査時 ( $N \times 1 0^M$ 回間隔 $N = 1 \sim 9 \cdot M = 0 \sim 8$ ) ( 1 ) キースイッチの O N / O F F 確認 ( 2 ) キースイッチ間のショート検出 ( 3 ) 接触抵抗値測定及び測定値に対しての良 否判定 ( 0.01 ~ 19.99 [ K ] STEP:10 毎 ) ( 4 ) バウンス時間判定値に対しての良否判定 ( 1 ~ 15 [ m s ] 測定精度 ± 1 [ m s ] )
(12)	キーボード マトリクス	M A X 1 6 × 1 6
(13)	表示	( 1 ) 液晶表示器 — { 操作案内・動作状態・ 不良内容 ( 2 ) パネルメータ — { 接触抵抗測定値・ ソレノイド通電電流 ( 3 ) 内蔵プリンタ — { 測定値・良否判定結果 ( 4 ) ブザー・ランプ { 良否判定結果

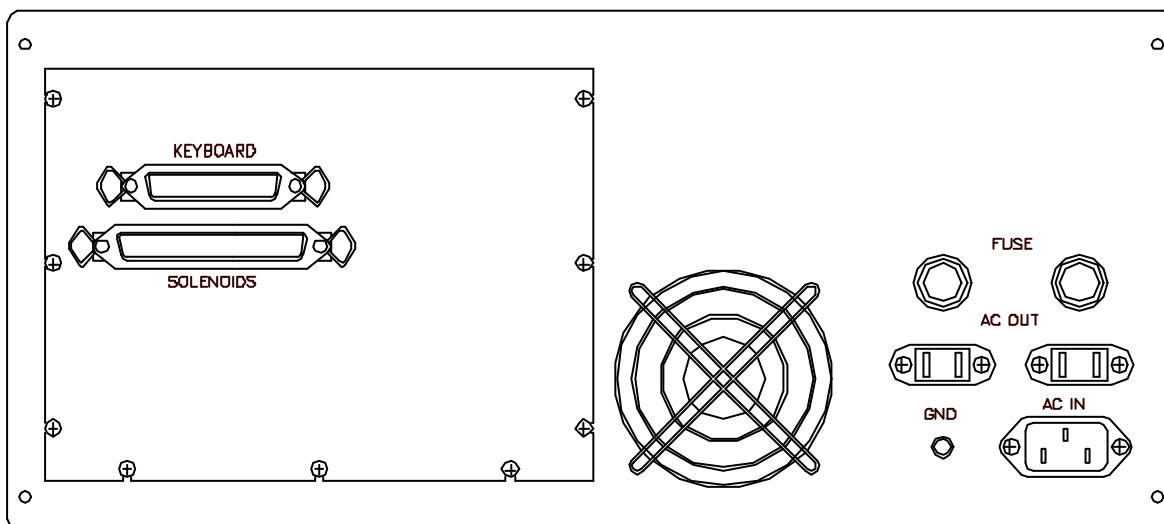
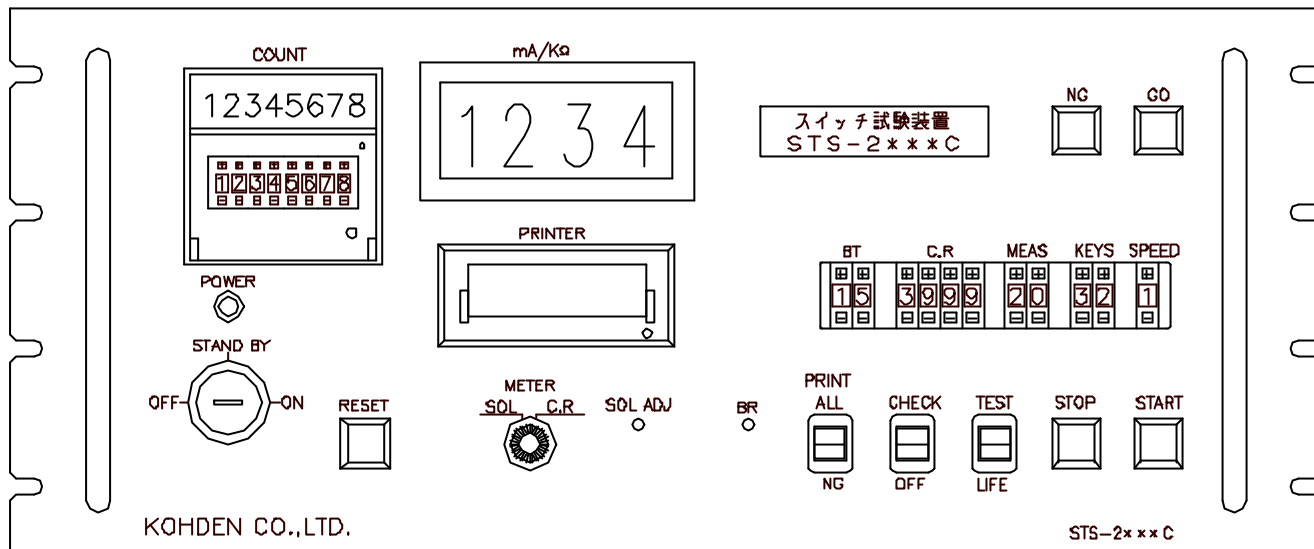
### 3.2打鍵機 STS-2\*\*\*M

	項 目	
3.2(1)	使用 温度範囲	0 ~ 40 [ ]
(2)	使用 湿度範囲	20 ~ 80 [%]
(3)	外形寸法	600(W)x470(H)x400(D)[mm]
(4)	アクチュエ ータ	ソレノイド ケージーエス(株)CA-134807
(5)	その他	『キーボードトレ』と『ソレノイドシャーシ』 のセッティングを変えることにより被試験キー ボードに対して、「上側打鍵」「下側打鍵」が出 来ます。

忖

# 4 . 外観図

## 4.1 コントローラ STS-2\*\*\*C



4.2 打鍵機 STS-2\*\*\*M

